

佐賀大学ビームラインの概要と光半導体材料研究

高橋和敏、今村真幸、山本勇、斎藤勝彦、東純平、郭其新

佐賀大学 シンクロトロン光応用研究センター

佐賀大学シンクロトロン光応用研究センターは、九州地域の大学や国内外の研究教育機関との連携によるシンクロトロン光応用研究および関連する研究教育活動などを行うことを目的の1つとして掲げ、SAGA-LS の開所時からナノスケール表面界面ダイナミクスビームライン(BL13)を整備し、利用を継続している。ビームラインは平面型アンジュレータまたは偏向部を光源とする2つの実験ステーションから構成されており、現在、約34~850eVまたは2~150eVのシンクロトロン光と、エンドステーションに設置した短パルスレーザーを用いた光電子分光測定、吸収、蛍光測定などを主な手法として、各種の機能性材料やナノ物質などの表面界面の電子状態分析を行うことが可能となっている。2つのステーションに設置の光電子分析装置はいずれもレンズ部で電子軌道を偏向させることによる3次元的なバンド分散の同定や、フェルミ面マッピングでの円2色性を通じた軌道およびスピントルビメトリの解明に有用である。また、低エネルギー領域を用いるステーションには紫外可視分光器を設置しており、深紫外領域での励起による種々の光半導体材料の評価を行うことができる。

図に、スピントロニクス応用とも関連して高い関心を集めているBi(111)上の表面電子状態について、広い波数範囲でCD-ARPESマッピングを測定した結果を実験配置の模式図とともに示す。Bi(111)表面のS1およびS2表面状態は、そのスピントルビメトリと電子状態の2次元性に基づいて記述されると考えられるθ_x方向において節を示す2色性が観測されることがわかった。また、講演では赤外域においても高い透過性を持つ透明導電性材料であるCd_xZn_{1-x}Oの3次元バンド構造についても紹介する。

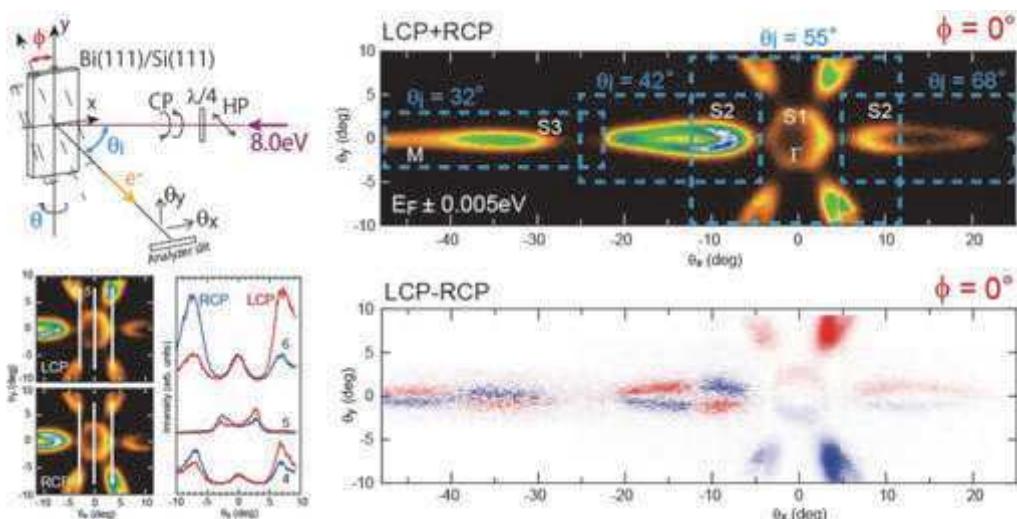


図1. Bi(111)表面のCD-ARPESマッピング

佐賀大学ビームラインの概要と光半導体材料研究

佐賀大学
シンクロトロン光応用研究センター

高橋和敏

Acknowledgments

ビームライン 今村真幸
レーザー、時間分解 山本勇、東純平
デバイス作製 斎藤勝彦、郭其新
近藤祐治、池永英司、丁剣、山重寿夫、杉山陽栄、小川浩二
鎌田雅夫、小川博司
山本樹(KEK-PF)、大熊春夫(SPring8)
P. Baltzer (MB Scientific AB)
UVSOR staff、SAGA-LS staff

文部科学省特別経費(プロジェクト分)H28~(6年間予定)
「九州地域シンクロトロン光活用拠点におけるイノベーション技術開発と人材育成」
「超顕微科学研究拠点事業」(阪大、九大、理研、佐賀大)
科研費 16K13726, 26286008

190520 SAGALS結果報告会

2

Outline

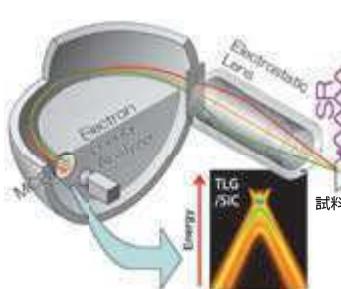
1. 佐賀大学ビームラインの概要
設備、利用状況、体制
2. 光半導体材料の電子状態分析
Bi(110)原子層の2次元バンド構造
 $Cd_xZn_{1-x}O$ の3次元バンド構造
3. まとめと展望

190520 SAGALS結果報告会

3

角度分解光電子分光 (ARPES)

光電子のエネルギー・角度分布を測定
→ バンド分散関係 $E(k_x, k_y, k_z)$ を実験的に決定



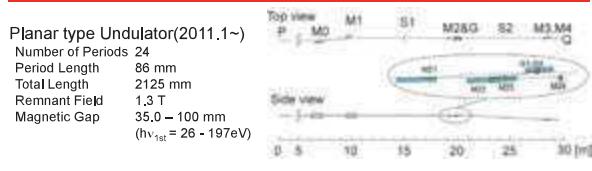
バンド分散関係 $E(k)$
金属・半導体材料の機能の起源

角度分解光電子スペクトル $I(E_\phi, \theta)$
エネルギー保存則 $E_B = h\nu - E_k - \phi$
運動量保存則 $k_f = K_f = (2m_e E_k)^{1/2} \sin\theta$
バンド分散関係 $E(k)$
スピン検出器
超短パルスレーザー
 $E(k, \sigma, \theta)$

190520 SAGALS結果報告会

4

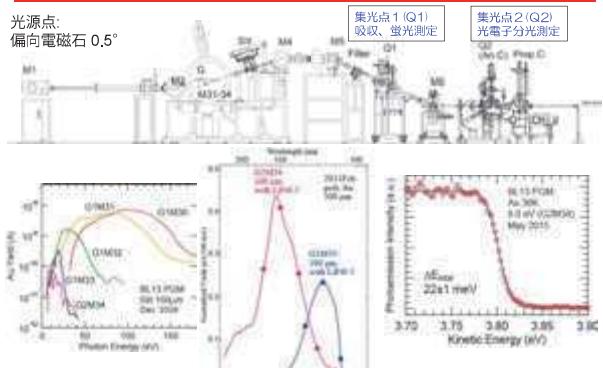
BL13 VLSステーション：概要



190520 SAGALS結果報告会

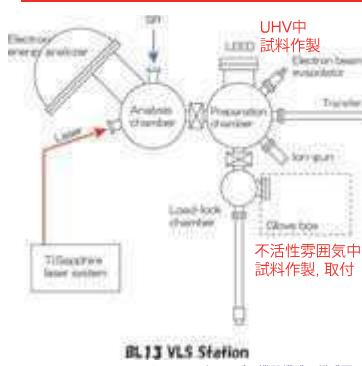
5

BL13 PGMステーション：概要



6

エンドステーション概要

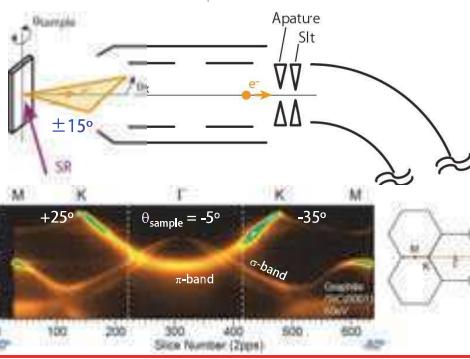


190520 SAGALS結果報告会

7

バンド分散測定の配置

θ_x についての同時測定と試料回転 θ_{sample} により、高対称線上バンド分散の高効率測定

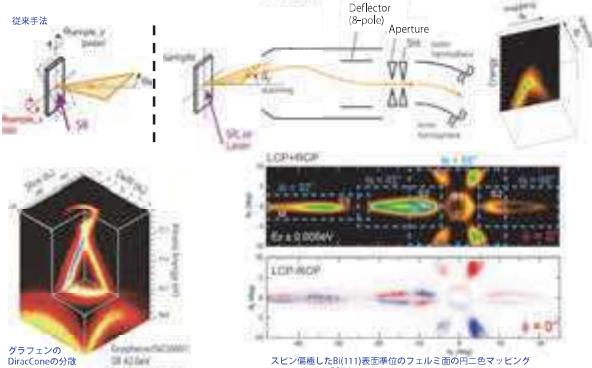


190520 SAGALS結果報告会

8

2次元マッピング型電子レンズ : A-1 Lens4

MB SCIENTIFIC AB
2013, 2014



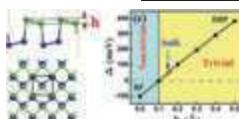
190520 SAGALS結果報告会

9

グラフェン上Bi(110)超薄膜のARPES実験

ビスマス(Bi)

長いフェルミ波長、小さな有効質量 → 量子サイズ効果、半金属-半導体転移
 大きな原子質量 → 表面ラシバ効果



最近、1 BL 膜の2次元トポロジカル
 絶縁体相への転移が予測
 -- buckling, 電荷移動、電界効果、
 膜厚に依存

目的：SiC上エビタキシャルグラフェンを基板としてBi超薄膜を作製し、
 広い波数範囲についてバンド分散を明らかにする。

190520 SAGALS結果報告会

10

実験

試料作製

基板: 3層グラフェン / 4H-SiC(0001)
 (熱分解法, 0°-off, SiCrystal AG, CMP treated)

・基板の清浄化 : UHV中アニール ($T_{subst} = 500^\circ C$, ~10hrs)

↓

・Bi蒸着とアニール処理

$T_{subst} = -170^\circ C$, $2 \times 10^{-8} Pa$

蒸着レート ~ 0.01 BL/min (1 BL = $18.5 \text{ atoms}/\text{nm}^2$)

$\Theta = 0.19$ BL → 1BL islands

$\Theta = 0.57$ BL → $T_{anneal} = 25^\circ C$, 30min → 2BL islands

$\Theta = 0.85$ BL → $T_{anneal} = 80^\circ C$, 60min → 3BL islands

測定

LEED測定

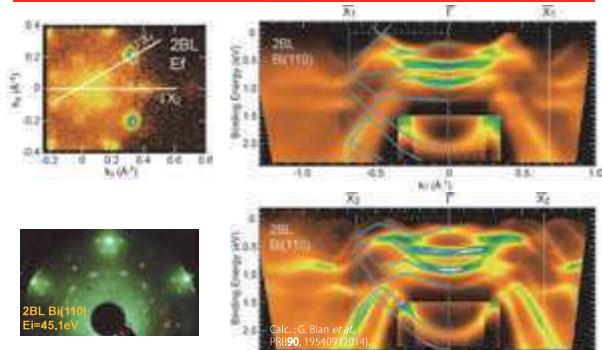
C 1s, Bi 4f, 5d 内殻PES ($h\nu = 680\text{eV}, 70\text{eV}, @40K$)

ARPES測定 ($h\nu = 15\text{eV}, @40K$)

190520 SAGALS結果報告会

11

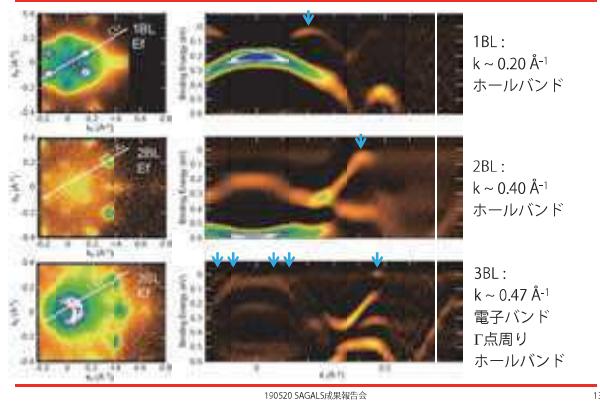
ARPES 2BL : 15eV 励起



190520 SAGALS結果報告会

12

Γ -X₁上バンド分散の詳細



190520 SAGALS結果報告会

13

まとめ

Bi(110)超薄膜を3層グラフェン上に作製し、ARPES測定によりバンド分散を明らかにした。

- 蒸着量とアニール処理条件に応じて、1~3BLのBi(110)島状超薄膜を作製することができた。

LEED測定 ARPSマッピング → Gr. Armchair || Bi Zigzag ±2°
× 3 domains

- 広い波数範囲についてバンド分散を決定した。

1BL : k ~ 0.20 Å⁻¹ (on Γ X₁, ホールバンド)

2BL : k ~ 0.40 Å⁻¹ (on Γ X₁, ホールバンド)

3BL : k ~ 0.47 Å⁻¹ (on Γ X₁, 電子バンド), Γ 点周りのホール面

- グラフェンとBi超薄膜の間に有意な電荷移動はない。

良質なBi(110)膜の形成のためには、平坦かつdangling bondが無い(Biとの化学結合を形成しない)基板であることが重要

190520 SAGALS結果報告会

14

Cd_{1-x}Zn_xO(001)の3次元バンド構造

Sci. Rep.
in press

高橋, 今村, 斎藤, 郭, J.H. Chang, 田中(佐大理工), K.M. Yu(香港市大), W. Walukiewicz(LBNL, UCB)

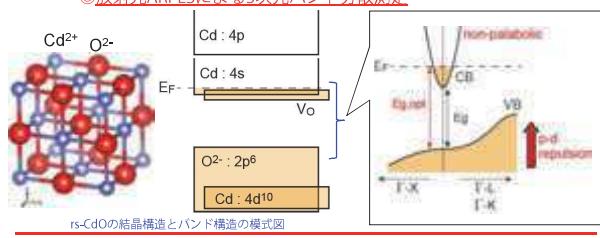
金属酸化物半導体 : 透明性 + 導電性

CdO -- 小さな有効質量のため赤外域透過率が高い (Δ ITO (In₂O₃:Sn))

Znとの混晶化での格子定数減少によりバンドギャップが増加

×酸素空孔などのため縮退半導体となり光学測定からのEg評価が難しい

→ ○放射光ARPESによる3次元バンド分散測定



190520 SAGALS結果報告会

15

Cd_{1-x}Zn_xO(001)の3次元バンド構造

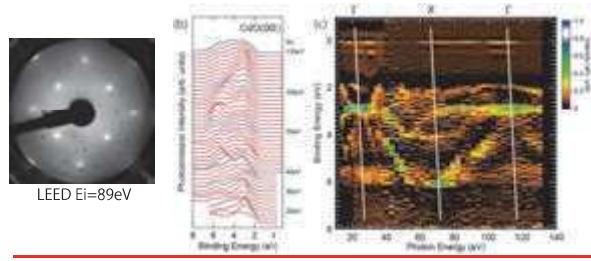
Sci. Rep.
in press

[試料作成] 基板 : MgO(001)単結晶

酸素プラズマ援用MBE, T_{subst} = 250°C, 膜厚 100 nm

[測定] UHV中350°Cアニールで清浄化

内殻 hν = 700 eV, バンド分散 hν = 14 - 130 eV, T_{measure} = 室温

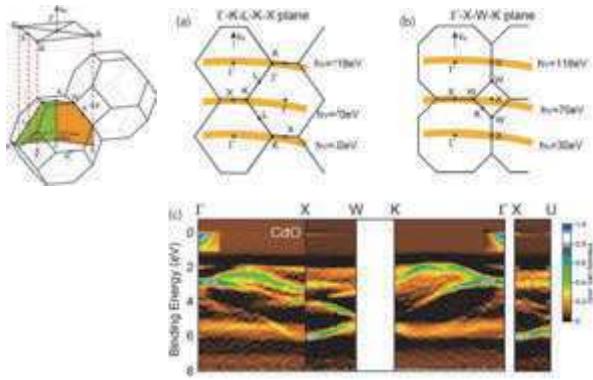


190520 SAGALS結果報告会

16

Cd_{1-x}Zn_xO(001)の3次元バンド構造

Sci. Rep.
in press

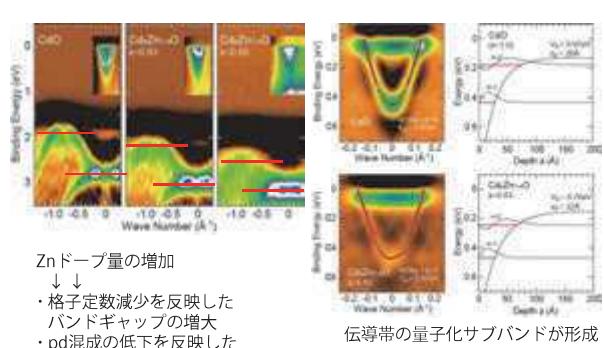


190520 SAGALS結果報告会

17

Cd_{1-x}Zn_xO(001)の3次元バンド構造

Sci. Rep.
in press



190520 SAGALS結果報告会

18

まとめ : Cd_{1-x}Zn_xO(001)の3次元バンド構造

Cd_xZn_{1-x}O (x=1, 0.83, 0.60)について、14-130eVでのARPES測定により3次元バンド分散を明らかにした。

- Zn ドープ量の増加とともに、直接および間接ギャップが増加するが伝導帯底は大きな変化はない。

$$E_{g, \text{direct}} = 1.79, 2.03, 2.0 \text{ eV}$$

$$E_{g, \text{indirect}} = 0.78, 1.09, 1.2 \text{ eV} \quad : \text{pd-repulsionの減少}$$

- 表面バンドベンディング領域への2次元電子ガス形成。

バルクキャリア濃度 : $2\text{-}3 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$

バンドベンディング : 0.8 - 1.1 eV → $z_0 \sim 30 \text{ \AA}$ の閉じ込めポテンシャル

→ 伝導特性に大きな寄与

まとめ

BL13佐賀大学ビームラインにおいて、VUV/SX領域での光電子分光実験、レーザーとの組合せによる光励起ダイナミクス研究を進めている。

- 角度分解光電子分光による光機能材料の電子状態解明

- 低次元電子系の電子ダイナミクス解明

- 分子デバイスに向けた構造と電子状態解明

ビームラインを設置していることの強み (距離、時間、継続性) を活かし、研究、教育を進展させたい。